



FSM-Precision

镜面外观缺陷检测系统

FM-DVM

产品功能

晶圆、基片及精密光学元件表面缺陷自动筛查和量测

检测对象

晶圆片、盖板、基片、精密光学元件（平晶，棱镜，玻片等）

面向行业

半导体晶圆生产、3C 盖板及光学基片、光学抛光加工



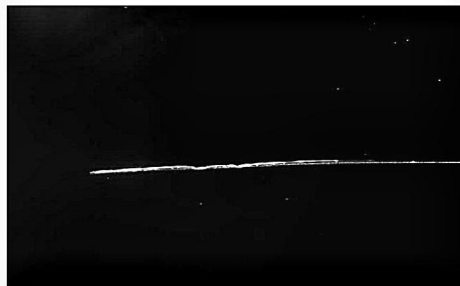
◆ 技术参数

- 缺陷最大检测口径 300X200mm（覆盖 8 寸晶圆，可订制 12 寸晶圆机台）
- 缺陷检测分辨率最高 0.5um
- 缺陷检测类型：麻点、划痕、纹理、异色、破边等
- 自动缺陷识别及尺寸量测
- 手动上下片，支持半自动和自动上下片的开发
-

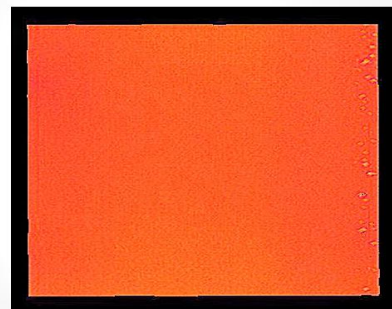
◆ 技术特点

- 采用多模式成像确保各种不同类型的缺陷能够被检测
- 可以按照 20/10、40/20、60/40 标准对缺陷进行量测判定
- 软硬件可以按照实际样品检测需求进行订制
- 可附带增加检测基片三维翘曲功能

◆ 测量实例



麻点和划痕



表面纹理